

Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

ASM Assembly Systems Leiterplattenbestücker SIPLACE TX2i

Report No. AS 1604-819

Qualifizierungsbescheinigung

Partikelemission





Qualifizierungsbescheinigung

Auftraggeber ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG

Rupert-Mayer-Straße 44 80200 München Deutschland

Untersuchte Komponente

Kategorie: Automatisierungskomponente

Subkategorie: Positioniersysteme

Typenbezeichnung: Leiterplattenbestücker SIPLACE TX2i

(Baujahr: 2016; Seriennummer: TA006; Materialnummer: 58000)

Stichprobenartige Partikelemissionsmessungen (luftgetragen) an repräsentativen Stellen

Standards/Richtlinien:

Messgeräte:

Testparameter der Prüfumgebung:

Testparameter der Versuchsdurchführung:

VDI 2083-9.1; ISO 14644-1

Die angegebenen Normen beziehen sich generell auf die zum Zeitpunkt der Untersuchungen gültige Fassung.

Optischer Partikelzähler:

LasAir II 110 und LasAir III 110 mit den Messbereichen \geq 0,1 μ m, \geq 0,2 μ m, \geq 0,3 μ m, \geq 0,5 μ m, \geq 1,0 μ m und \geq 5,0 μ m

•	Reinraum Luftreinheitsklasse (gemaß ISO	14644-1):
•	Luftströmungsgeschwindigkeit:	0,45 m/s
•	Strömungsführung:	vertikale laminare Strömung
•	Temperatur:	22°C±0,5°C
	Relative Fouchte:	15 % + 5 %

• Messung Gesamtanlage innen und außen

- Bewegungszyklus: Standardzyklus für Lebensdauertests (ASM)

• Einzelbewegung x-Achsen

- verialitiveg.	
- Geschwindigkeit:	1,73 m/s
- Verweilzeit in den Endlagen:	500 ms
Einzelbewegung y-Achsen	
- Verfahrweg linke Achse:	0,64 m
- Verfahrweg rechte Achse:	0,27 m
- Geschwindigkeit linke Achse:	1,83 m/s
- Geschwindigkeit rechte Achse:	1,34 m/s

Verweilzeit in den Endlagen:.Einzelbewegung Köpfe

- Bewegungszyklus: fortlaufende Bewegung aller Achsen - Geschwindigkeit: Maximum der jeweiligen Achse

• Einzelbewegung Förderer



Untersuchungsergebnis / Klassifizierung

Der Leiterplattenbestücker SIPLACE TX2i ist unter den angegebenen Testparametern geeignet, in Reinräumen der folgenden Luftreinheitsklasse gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden:

Testparameter	Luftrein- heitsklasse	Testparameter	Luftrein heitsklasse
Kopf CPP, links	7	Kopf CP_20P, links	7
Außen, mit Gurten	7	Außen, ohne Gurte	7
Innen, mit Gurten	7	Innen, ohne Gurte	7
Linkes x-Portal	7	Rechtes x-Portal	7
y-Portale	8	Transport und Hubtische	7
Förderer 8 mm und Scheidegerät mit Gurt, linker Tisch	6	Förderer 8 mm und Scheidegerät ohne Gurt, rechter Tisch	5
Förderer 24 mm, ohne Gurt, rechter Tisch	5	Förderer 56 mm, ohne Gurt, rechter Tisch	6
Gesamtergebnis		7	

Schlechtere Bewertungen von Einzelkomponenten werden im Gesamtergebnis nicht berücksichtigt, da deren Einzelbetrieb kein reales Einsatzszenario darstellt und lediglich der Lokalisierung von Partikelquellen zur Ableitung möglicher Optimierungsmaßnahmen dient.

Die für die Qualifizierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind auf nationale und internationale Normale rückführbar. Sofern keine nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen. Die Dokumentation kann bei Bedarf eingesehen werden.

Weitere Informationen bezüglich Prüfumgebung und -parameter entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA

Abteilung Reinst- und Mikroproduktion

Nobelstraße 12 70569 Stuttgart Deutschland Stuttgart, 08 November 2016

Ort, Datum Erstausstellung

Ort. Datum Aktualisierung

A. Pürgar Projektleiter Fraunhafar IRA

Die Gültigkeit dieser Bescheinigung beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form ab Erstausstellungsdatum für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf

www.tested-device.com überprüft werden.